

Messen und analysieren mit Optik, Taster, Computertomografie und Multisensorik



Sehr geehrte Damen und Herren,

diesmal informieren wir Sie über das Messen von Schichten, die mit Licht vom sichtbaren bis in den infraroten Bereich durchdrungen werden können, hier kommen chromatische Sensoren zum Einsatz.

Im Bereich der Computertomografie zeigen wir Ihnen, wie Artefakte, die durch Strahlaufhärtung und Streustrahlung verursacht werden, reduziert werden können.

Entdecken Sie Innovatives und Bewährtes. Überzeugen Sie sich von unseren Produkten der Multisensorik und der Computertomografie:

Schnelle Schichtdickenmessung mit chromatischem Sensor

Typische Einsatzbereiche für die Schichtdickenmessung sind dünne Glasplatten, Folien, Luftspalte, Lackdicken, Schutzschichten auf elektronischen Komponenten, Wafer, Membranen von Lautsprechern oder Ballonkatheter.

Lesen Sie [hier](#) weiter.

WinWerth® Artefaktkorrekturen

Beim Messen mit Computertomografie treten prinzipbedingt als Artefakte bezeichnete systematische Messabweichungen im Volumen auf. In die Messsoftware WinWerth® integrierte Korrekturverfahren können Artefakte stark reduzieren und die Messgenauigkeit entsprechend erhöhen.

Lesen Sie [hier](#) weiter.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine Beratung durch unsere Spezialisten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter +49 641 7938-519 oder senden Sie uns eine E-Mail an vertriebsinnendienst@werth.de.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Werth Messtechnik GmbH

Werth Messtechnik GmbH
Siemensstraße 19
35394 Gießen, Deutschland

Geschäftsführer
Dr.-Ing. habil. Ralf Christoph
Sitz Gießen, Reg.-Nr. HRB 211

Tel. +49 641 7938-0

mail@werth.de

www.werth.de